

お客様各位

SEMICON Japan 2015出展のご案内

株式会社アークステーション

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、皆様のご支援により弊社は「セミコンジャパン2015」に出展する運びとなりました。
今回の展示会では、各種技術サポート業務受託のご提案、取り扱い装置のご紹介を行います。
ご多忙中とは存じますが、ご来場の際は是非お立ち寄り下さい。心よりお待ち申し上げております。 敬具

会 期： 2015年12月16日（水）～2015年12月18日（金） 10：00～17：00
会 場： 東京ビックサイト
主 催： SEMI
ブース： Hall 3 3237

<見どころ>

1. 技術支援業務（保守業務委託／保守業務移管／エンジニア派遣）
2. 取り扱い製品のご紹介（ウェーハ検査・計測装置）
 - ・NOVA社製膜厚測定装置
 - ・Revera社製全自動XPS膜厚濃度測定装置
 - ・東京航空計器社製重ね合わせ精度測定装置
 - ・東朋テクノロジー社製卓上型膜厚測定装置
 - ・ZETA社製光学式3次元測定装置
 - ・ZETA社製透明ウェーハ表裏欠陥検査装置
 - ・中古装置
膜厚測定装置、検査装置
3. 共同出展者
 - ・株式会社ティエステイ
 - ・東京航空計器株式会社



※詳細はセミコンジャパン2015 ホームページから検索できます。
「来場者の方」→「出展者一覧・検索」→「(株)アークステーション」
※入場登録はセミコンジャパン2015ホームページからの登録となります。

<会場マップ>

Hall 3

